



MD 1023 Y 2016.04.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 1023 (13) Y
(51) Int.Cl: B82Y 35/00 (2011.01)
G01D 5/12 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/26 (2006.01)
G01R 31/27 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE DE SCURTĂ DURATĂ

Table with 2 columns and 2 rows containing patent details: term of opposition, deposit info, publication date, applicant, inventor, and owner.

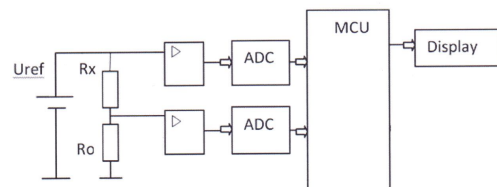
(54) Dispozitiv de măsurare a parametrilor senzorilor pe bază de oxizi semiconductori micro- și nanostructurați

(57) Rezumat:

Invenția se referă la domeniul tehnicii de măsurare și poate fi utilizată în aparate de măsurat, în care se utilizează senzori pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați. Dispozitivul de măsurare a parametrilor senzorilor pe bază de oxizi semiconductori micro- și nanostructurați include o sursă de tensiune de referință (Uref), tensiunea căreia se aplică la intrarea unuia din convertorii analogic-digitali (ADC) ai unui microcontroler (MCU) printr-un amplificator operațional, și care este conectată în serie cu o nanostructură cercetată (Rx) și un rezistor suplimentar (R0), iar căderea de tensiune de pe rezistorul suplimentar (R0) se aplică la intrarea unui al doilea convertor analogic-digital (ADC) al

microcontrolerului (MCU) prin cel de-al doilea amplificator operațional. Ieșirea microcontrolerului (MCU) este conectată la un ecran pentru afișarea rezultatelor obținute.

Revendicări: 1
Figuri: 2



MD 1023 Y 2016.04.30